

走査型電子顕微鏡

【メーカー】(株)日立ハイテクノロジーズ

【型式】S-3400N

【設置場所】農学部本館1階1P-108

【仕様】

- ・二次電子像分解能：3.0nm保証(高真空)(30kV)
- ・二次電子像分解能：10nm保証(高真空)(3kV)
- ・反射電子像分解能：4.0nm保証(低真空モード)(30kV)
- ・倍率：5～300,000倍
- ・加速電圧：0.3～30kV
- ・低真空度設定：6～270Pa
- ・イメージシフト：±50 μ m(WD=10mm)

機器画像
準備中

機器説明

試料に電子線を当てることで生じる反射電子・二次電子の信号を集積し、表面構造を観察することが可能です。

●低真空モード対応の反射電子検出器、高真空モード対応の反射電子・二次電子検出器搭載。

●植物や虫、金属、微生物、食品など、前処理の施し方によって、多様な試料を測定可。

※粉末の場合は真空下での扱いに注意。